

05.4
©1995

**МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И СТРУКТУРА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КОМПОЗИТОВ
 $\text{YBCO/Cu}^\gamma\text{O}$**

*Е.М.Гололобов, А.С.Масаковская, Н.В.Беляева,
Н.Е.Стрелюхина*

Высокотемпературные сверхпроводящие (ВТСП) керамики относятся к классу хрупких материалов. Их механические свойства представляют определенный интерес, сведения о них необходимы для совершенствования технологии получения ВТСП керамик, пригодных для прикладного использования.

Оценку механических свойств образцов из ВТСП керамик обычно проводят методом микроиндицирования [1,2], и судят о прочности и пластичности по микротвердости.

В ранее проведенных работах по созданию композиционных керамик на основе состава YBCO с оптимальным комплексом электрофизических свойств установлено [3,4], что добавление в $\text{YBA}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ порядка 2.5 мас.% облученного γ -квантами ^{60}Co порошка меди или оксида на его основе улучшает сверхпроводящие свойства композита. Установлено также существенное увеличение микротвердости [5].

Настоящая работа посвящена исследованию влияния добавок оксида меди, полученного на основе облученного γ -квантами ^{60}Co порошка меди, в иттрийсодержащую керамику на механические и структурные свойства композиционного материала $\text{YBA}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}/\text{Cu}^\gamma\text{O}$.

В качестве базового объекта для исследования была взята керамика $\text{YBA}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$, полученная нитратным способом с размером частиц ~ 25 мкм, и медный порошок, полученный электролизом с размером частиц ~ 5 мкм. Медный порошок подвергался облучению γ -квантами ^{60}Co дозой $8.8 \cdot 10^9$ Р, а затем окислялся в среде кислорода при температуре 940°C в течение 4 часов с последующей закалкой на воздухе (Cu^γO). Цель и результаты такой обработки приведены в работе [3].

Для приготовления образцов композита к иттриевой керамике добавляли от 2.5 до 40 мас. % Cu^γO . Способ приготовления образцов в виде таблеток и режим спекания ана-

логичен описанному в работе [3]. Все образцы были сверхпроводящими ($T_c = 91 - 94$ К).

Исследованию подвергались торцевые отполированные поверхности таблеток. Для определения механических характеристик применялась микроиндентерная техника. Исследование микротвердости (H) и трещиностойкости (K_{IC}) проводили на приборе ПМТ-3 при нагрузках 0.2 Н, 0.5 Н с учетом рекомендаций, приведенных в работах [1,2,6-9]. Такие величины нагрузок позволяли оценить микротвердость отдельных зерен сверхпроводящей (СП) фазы 123 и влияние межзеренных прослоек на прочность композиционной керамики в целом. Значения H усреднялись по 15 отпечаткам. Трещиностойкость определяли по методике и формуле, приведенной в работе [9].

Структура композитов исследовалась с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-3 (излучение $CuK\alpha$), растрового электронного микроскопа РЭМ-100 У и металлографического микроскопа "Неофот-2".

Зависимость микротвердости керамических композитов от концентрации вводимой примеси $Cu^{\gamma}O$ ($H(\Pi)$) приведена на рис. 1 (кривая 1). Отпечатки, полученные при нагрузке на индентор $P = 0.5$ Н охватывали площадь нескольких зерен. Зависимость $P(\Pi)$ имеет немонотонный характер с двумя максимумами. Немонотонная зависимость $H(\Pi)$ связана с изменением механизма влияния добавок $Cu^{\gamma}O$ на

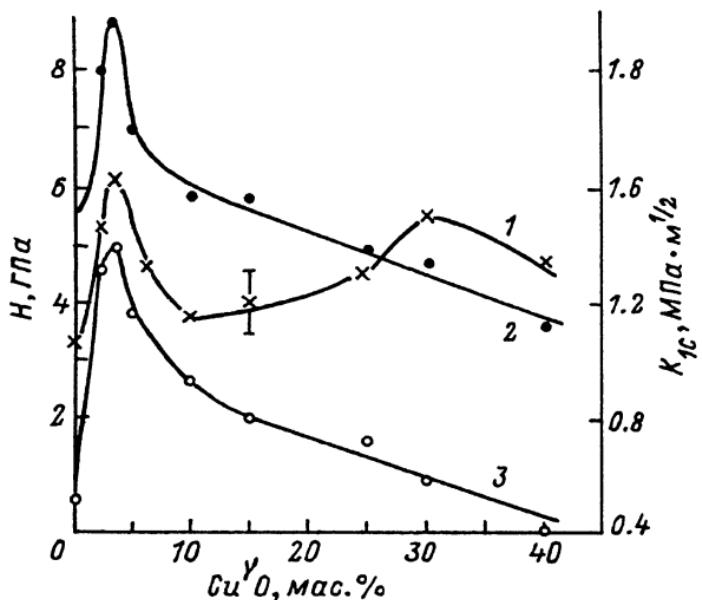


Рис. 1. Зависимость микротвердости (кривые 1, 2) и трещиностойкости (кривая 3) композиционных керамических образцов от концентрации вводимой добавки $Cu^{\gamma}O$.

процессы микродеформации и разрушения. Первый максимум микротвердости получен при концентрации добавки $\text{Cu}^{\gamma}\text{O} \sim 3.5$ мас.%. Полученный результат можно объяснить увеличением содержания кислорода в СП фазе [10] за счет диффузии его из $\text{Cu}^{\gamma}\text{O}$ при спекании. В этом случае примеси $\text{Cu}^{\gamma}\text{O}$ служат своего рода внутренним источником кислорода, который выделяется при термической обработке [3–5]. Увеличение содержания кислорода в решетке 123 фазы приводит к повышению микротвердости этой фазы и всего образца.

Второй максимум микротвердости наблюдается при концентрации примеси ~ 30 мас.%, что можно объяснить смешной механизма спекания керамики с увеличением количества вводимой добавки $\text{Cu}^{\gamma}\text{O}$. Учитывая, что образцы содержат купрат иттрия-бария 123 и оксид меди, а температура перитектического взаимодействия этих соединений, по данным [11], соответствует 940°C , можно говорить о следующей реакции:



где $L(P)$ — перитектическая жидкость.

Появление жидкой фазы в зоне контакта кристаллов при нагревании керамики до $T = 940^{\circ}\text{C}$ ведет к упрочнению межгранулярных контактов, а следовательно к увеличению твердости керамики.

При дальнейшем увеличении количества вводимой добавки $\text{Cu}^{\gamma}\text{O}$ твердость керамики все в большей степени будет определяться твердостью добавки. Так как CuO имеет меньшую твердость, общая твердость композита снижается.

На рис. 1 (кривая 2) представлена зависимость $H(\Pi)$, полученная при микроиндицировании фазы 123 при нагрузке 0.2 Н. Размер отпечатка удовлетворял условию определения микротвердости отдельной структурной составляющей. При небольших концентрациях примеси ($\Pi < 10$ мас.%) характер зависимости $H(\Pi)$ (рис. 1, кривая 2) аналогичен кривой $H(\Pi)$ (рис. 1, кривая 1). Объяснения увеличения микротвердости, приведенные выше, справедливы и для данного случая зависимости от концентрации кислорода в СП фазе. Это подтверждается и данными рентгеноструктурного анализа. Параметр C решетки фазы 123 при 2.5 мас. % $\text{Cu}^{\gamma}\text{O}$ равен 11.656 Å. При дальнейшем увеличении концентрации примеси параметр C увеличивается. Происходит изменение стехиометрии состава СП фазы и уменьшение микротвердости. При 20 мас. % примеси величина микротвердости СП фазы композиционных образцов становится меньше микротвердости СП фазы исходной керамики.

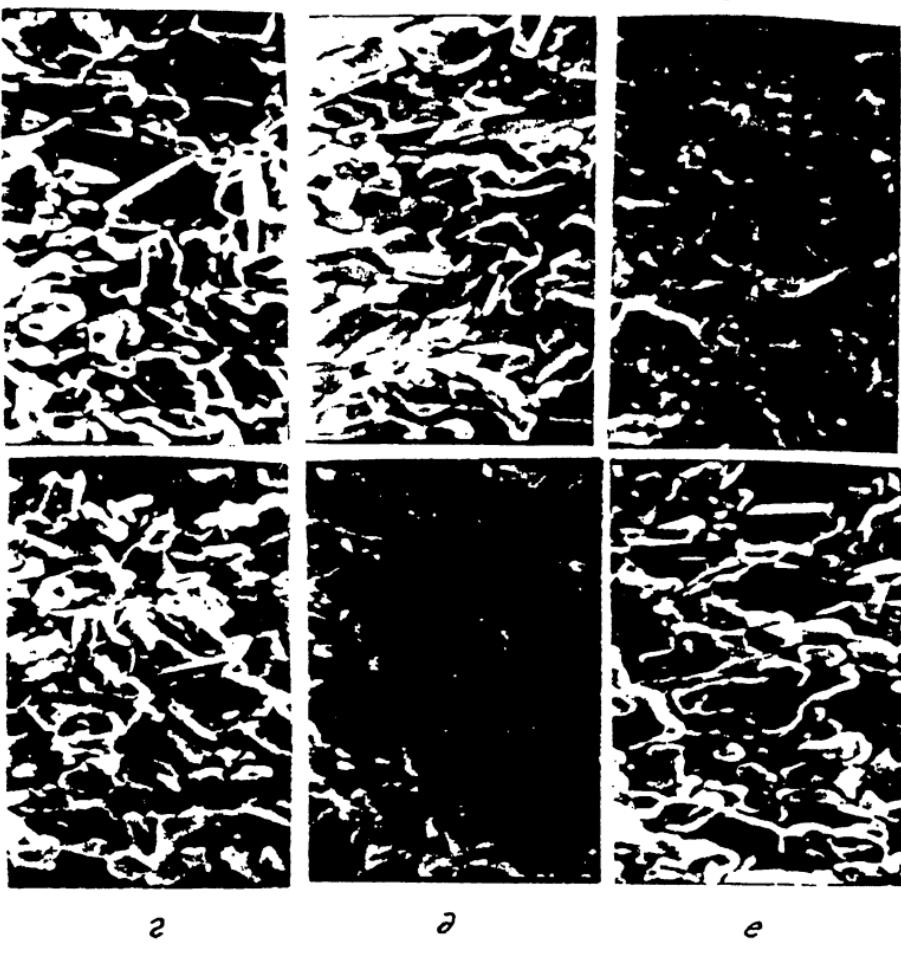


Рис. 2. Электронные фотографии структуры образцов YBCO/Cu γ O:
а — базовый образец; с добавкой Cu γ O: б — 3.5 мас.%; в — 10 мас.%;
д — 25 мас.%; е — 30 мас.%; г — 30 мас.% CuO.

С зависимостью $H(\Pi)$ (рис. 1, кривая 2) хорошо коррелируется зависимость $K_{IC}(\Pi)$ (рис. 1, кривая 3). Как видно из графика, максимальные значения трещиностойкости имеют кристаллиты образцов с небольшим содержанием примеси (до ~ 5 мас. %). Далее значения трещиностойкости снижаются. Численные значения K_{IC} не выходят за рамки значений трещиностойкости, полученных другими авторами [8,9].

На рис. 2 представлены электронные микрографии сколов композиционных керамических образцов. Как видно, исходная керамика состоит из кристаллитов фазы 123 полиэдрической формы, не имеющих направленной ориентации. Характерны пористость, проявляющаяся в черных пятнах межзеренного пространства, и широкий диапазон распределения по размерам (рис. 2, а). Добавки 2.5–3.5 мас.% Cu γ -O способствуют формированию более

плотной структуры (рис. 2, б). Структура образцов с добавками 10 мас.% Cu⁷⁰O характеризуется значительной разнозеренностью (рис. 2, в). С увеличением концентрации примеси Cu⁷⁰O в керамике растет процентное содержание фазы CuO. Композиции с 25–30 мас. % Cu⁷⁰O отличаются плотноупакованной, текстурированной структурой (рис. 2, е, д).

Текстурированность образцов оценивалась отношением интенсивности дифракционных линий (003) + (010), (005) + + (014) и (006) + (020) к наиболее интенсивной линии (110) + + (103) фазы 123. Текстурированность проявлялась при концентрации добавок Cu⁷⁰O более 10 мас. %. Например, при добавке 30 мас. % Cu⁷⁰O $\frac{J(006)}{J(110)} = 1.55$, а при добавке в керамику 3.5 мас.% Cu⁷⁰O это отношение составляет 0.27. Следует отметить, что при введении в керамику оксида меди, полученного на основе необлученной меди, текстура не наблюдалась во всем диапазоне концентраций добавок вплоть до 40 мас.%(рис. 2, г).

В результате выполненного исследования установлено, что в композитах на основе иттрийсодержащих ВТСП и Cu⁷⁰O можно не только улучшить сверхпроводящие свойства фазы 123 [3], но и регулировать ее механические свойства и структуру, в частности, микротвердость, трещиностойкость и текстурирование.

Работа профинансирована Фондом фундаментальных исследований республики Беларусь.

Список литературы

- [1] Демирский В.В. и др. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 6. С. 263–268.
- [2] Грабко Д.З. и др. // СФХТ. 1989. Т. 2. № 6. С. 67–72.
- [3] Гололобов Е.М. и др. // СФХТ. 1993. Т. 6. № 11–12. С. 2104–2110.
- [4] Степаненко А.В. и др. // СФХТ. 1991. Т. 4. № 10. С. 1981–1987.
- [5] Беляева Н.В. и др. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. В. 5. С. 33–37.
- [6] Cook R.F. et al. // Appl.Phys. Lett. 1987. V. 51. N 6. P. 454–467.
- [7] Ohiai S. et al. Jap. J. Appl. Phys. 1988. V. 27. N 6. P. L1101–L1107.
- [8] Мосолов А.Б. // СФХТ, 1991. Т. 4. № 2. С. 327–330.
- [9] Демирский В.В. и др. // СФХТ. 1990. Т. 3. № 1. С. 84–89.
- [10] Бобров В.С. и др. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 4. С. 93–99; N 6. С. 263–267.
- [11] Aslage T., Keefer K. // J. Mater. Res. 1988. V. 3. N 6. P. 1279–1291.

Институт физики
твердого тела
и полупроводников АНБ

Поступило в Редакцию
5 декабря 1994 г.